

蛍光X線分析装置

メーカー	株式会社 堀場製作所
型式	XGT-9000
装置概要	試料にX線を照射する際に発生した特性X線を検出、解析した結果、試料を構成する元素および組成情報が得られます。試料の組成比 (wt.%) を標準試料を用いない半定量法により算出します。
性能・特徴	<p>試料サイズ：200×200×60mmまで設置可能 分解能：100μm 検出器：シリコンドリフト検出器</p> <ul style="list-style-type: none"> 試料表面のNa～Uまでの範囲の元素（RoHS規制対象物質のCrやPbを含む）を検出できます。 また、固体・液体・粉体の試料に対応可能です。光学CCDによる計測部分のイメージ画像に計測結果を重ね合わせた画像にして、マッピング表示ができます。

①ピーク分離による異物・不良解析

粒子強調表示

フィルム中の埋没異物解析

複数画像掛け合わせ

LEDパターンの不良解析

ピーク分離マップ

従来

ピーク分離マップ

ICパッケージ内部の不良解析

食品中金属異物の解析

②マッピングによる基板上的のブリッジの検出

Cu (緑) Ag (赤) Br (黄)

重ね合わせ

測定時間は13分



設置場所：地方独立行政法人青森県産業技術センター工業総合研究所 機器分析室

※本装置は、公益財団法人 JKAの補助を受けて導入しました